

S1NAD80

800V 3A

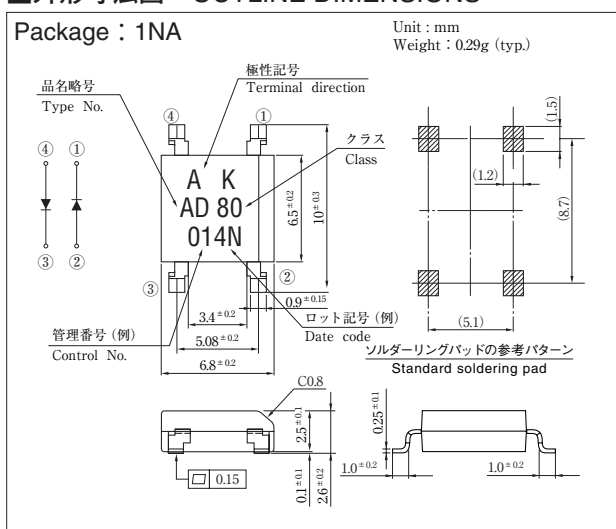
特長

- 小型面実装
- ツイン
- 耐湿性に優れ高信頼
- 自動実装対応

Feature

- Small SMD
- Twin-Di
- High-Reliability
- for Auto-Mount

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

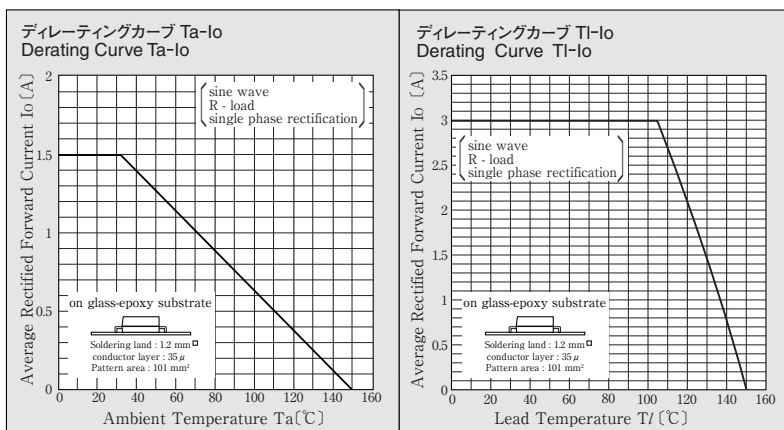
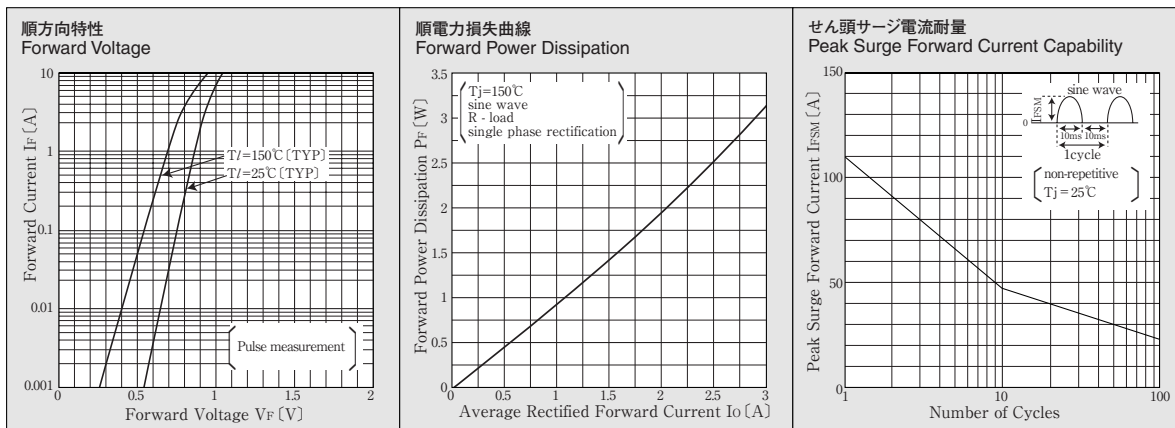
| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 品名 Type No. | S1NAD80 | 単位 Unit |
|---|------------------|--|-----------------------|---------|------------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -55~150 | °C |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | Tj | | | 150 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V _{RM} | | | 800 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I _O | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, | T _l =102°C | 3 | A |
| | | | T _a =31°C | 1.5 | |
| せん頭サーシ順電流 Peak Surge Forward Current | I _{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C | | 110 | A |
| 電流二乗時間積 Current Squared Time | I ² t | 1ms ≤ t < 10ms T _j =25°C | | 60 | A ² s |

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 規格値 Specification | 単位 Unit |
|---------------------------|------------------|--|----------------------|------------|
| 順電圧 Forward Voltage | V _F | I _F =0.75A, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 1.05 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I _R | V _R =800V, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 10 | μA |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{j-l} | 接合部・リード間, プリント基板実装 Junction to Lead, On glass-epoxy substrate | MAX 15 | °C/W |
| | θ _{ja} | 接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate *1 | MAX 84 | |

*1: 銅箔パターン101mm²
Copper soldering pad Area 101mm²

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.